

△の数	訂	正	記	事	担当	検図	年月日	△の数	訂	正	記	事	担当	検図	年月日
△								△							
△								△							
適用規格															
定 格	使用温度範囲		-55℃～85℃(注1)				保存温度範囲		-10℃～60℃(注2)						
	電 圧		AC 100 V				使用湿度範囲		40 % ～ 80 %						
	電 流		0.5 A				保存湿度範囲		40 % ～ 70 % (注2)						
性 能															
	項 目		試 験 方 法				規 格				QT	AT			
構 造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○			
	表示		目視にて確認する。								○	○			
電 氣 的 性 能	接触抵抗		100 mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。				40 mΩ以下				○	—			
	低電圧、低電流下の接触抵抗		20 mV以下、1 mA (DC または 1000Hz) で測定する。				50 mΩ以下				○	—			
	絶縁抵抗		DC 250 Vで測定する。				100 MΩ以上				○	—			
	耐電圧		AC 300 Vの電圧を1分間印加する。				せん絡・絶縁破壊がないこと。				○	—			
機 械 的 性 能	総合挿抜力		適合コネクタで測定する。				差込力 (0.88 × 極数) N以下 差抜力 (0.1 × 極数) N以上				○	—			
	繰り返し動作		100 回の抜き差しを行う。				① 接触抵抗: 50 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—			
	耐振性		周波数 10 ～ 55 Hz, 片振幅 0.76 mm, 3 方向各 2 時間試験する。				① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—			
	耐衝撃性		加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3方向各 3 回試験する。								○	—			
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性		温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。				① 接触抵抗: 50 mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上				○	—			
	温度サイクル		温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→ MAX 5 → 30→ MAX 5 分 を 5 サイクル試験する。				③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。				○	—			
	塩水噴霧		濃度 5 % の塩水、48 時間放置する。				① 接触抵抗: 50 mΩ以下				○	—			
	硫化水素		濃度 3 ppm、96 時間放置する。 (試験規格: JEIDA 38)				② はなはだしい腐食がないこと。				○	—			
	はんだ耐熱性		リフローの場合: ピーク温度 MAX250℃ 220℃以上 60秒以内 はんだごての場合: こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内				外観の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。				○	—			
	はんだ付け性		はんだ温度 240±5℃、浸せき時間 3 秒間のはんだ付けを行う。				はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。				○	—			
備考															
注1. 通電時の温度上昇を含みます。															
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。															
試験規格の記載のない試験方法はMIL-STD-1344を適用している。															
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目															
製品名															
FX6-※※S-0.8SV(71)															
製品コード															
CL576															
1															
1															

IBCL
CL

図番
SLC4-071177-25

製品規格表

1
1